Vol. 6, No. 1 January, 1986

纯氩空心阴极放电中 Ar+4p-4s态的粒子数反转

李世芳 胡企铨 殷立峰 林福成 (中国科学院上海光学精密机械研究所)

提 要

本文报道利用激光感生荧光测量方法在纯量直流空心阴极放电(HCD)中探测到 Art 42-48 态间存在 粒子数反转,给出了实验数据,并作了相应解释。

对正柱放电氩离子激光器的反转机理早已进行了理论和实验的研究^[1],但这些研究大都是在大电流和高电子温度情况下进行的。Rózsa 和 Solanki 等也曾有过 He-Ar 空心阴极 离子激光器的报道^[2,3]。 我们过去利用脉冲激光感生荧光的方法研究了 Ne 空阴极放电中 1s₂-2p 态间粒子数能否反转的问题^[4]。本文报道在连续激光激励条件下纯 Ar 直流空阴极 放电(HCD)中获得 Ar⁺ 谱的负感生荧光信号,首次报道了 Ar⁺ 的 4*p*-4s 态间的粒子数反 转情况,并对其形成的机理作了初步探讨。

一、实验装置

图1给出了我们所用的实验装置框图。连续 Ar* 激光器输出功率约为 4W, 其中主要



Fig. 1 Experimental setup

收稿日期: 1985年2月17日; 收到修改稿日期: 1985年3月28日

的四条谱线波长为: 476.5 nm、496.5 nm、488.0 nm、514.5 nm, 它们的输出功率之比为 1:3:3.3:3.9。线宽均约1GHz, 它经127Hz 斩波后射入 HCD 灯*中。灯中充有约3Torr 的纯 Ar, 阴极孔直径约 4mm, 有效长度为 10mm。HCD 灯发射的荧光经反射镜 M 反射 后,由透镜 L 聚焦在 WDG 500 型光栅单色仪的狭缝上,经单色仪色散后,由光电倍增管 PM 接收, 送入锁相放大器放大。 放大后的信号由记录仪记录。 整个接收系统的光谱响应 已经用标准钨带灯校定过了。

二、结果和讨论

1. 感生荧光谱线



Fig. 2 Transitions of excitation laser (straight line) and transitions of laserinduced fluorescence (wavy line)

在连续 Ar⁺ 激光全线激励下,测量了 300~480 nm 和 530~800 nm 波长范围内 直 流 HCD 中 Ar⁺ 的激光感生荧光谱。 它们分别为 454.5 nm、472.6 nm、422.8 nm、442.6 nm 等四条感生荧 光谱线,其上能级分别对应于 Ar* 激光器的四条主要 谱线 476.5 nm、496.5 nm、488.0 nm、514.5 nm 的 上能级,如图2所示。用单线激励进行验证表明,它们 确属感生荧光信号,正如所预期那样,它们都是属于这 些上能级可能发射的谱线中 gA 数最大的 [5]。 图 3 给 出了这四条谱线附近的发射光谱图和感生荧光光谱 图。由图3可见,这四条谱线的感生荧光都是负信号。 表明在激光作用下,这四条谱线的荧光发射强度都减 小。这一点在Ne的非反转能级所作的类似实验中表 明,在共振激光作用下,当能级间粒子数不反转时,感 生荧光是正信号[+]。

我们还测量了 454.5 nm 和 472.6 nm 两条谱线 的感生荧光强度随 HCD 灯放电电流的变化,其结果如图 4 所示。作为比较,图 5 中给出了 454.5nm、472.6nm、422.8nm 和 442.6nm 四条谱线的发射荧光强度随 HCD 灯放 电电 流的变化关系,两者的变化规律基本上是一致的。

由于实验中测量到的感生荧光信号很小,因此,我们在实验中采用了较强的辐照激光功 率和较大的灯放电电流。但是过强的辐照激光功率将产生一个较大的散射光背景信号,图3 (a)、(b)中,中间曲线是 H_{HCD}=0时,由散射激光引起的背景噪声,其中 454.5 nm 线后边 一个上升峰是 Ar* 激光器 457.9 nm 的一条较弱的输出线。同时,较大的放电电流(已达到 或超过灯的最高额定电流值)将会引起灯的热不稳定性,从而导致测量误差的增大。在实际 的测量中必须选择合适的参数以获得较高的信噪比。

2. 共振能级间的速率方程

实验表明,由于共振激光的作用,从激光上能级发射的荧光强度变小,它直接证明了相 应共振能级间粒子数是反转的。

6 卷

^{*} 市售的 Ar-Zn 灯,采用高压稳压电原供电以保证低嗓音。



Fig. 3 Laser-induced fluorescence spectrum (a) and emission spectrum (b) of the Ar^+



Fig. 4 Intensity of laser-induced fluorescence vs. current of HCD lamp



作为初步的分析,考虑如图 6 所示的能级系统,我们建立起感生荧光、发射荧光强度及 ⁷²³ B₁₂ 2 ⁿ² 其自发辐射系统和能级寿命间的关系式。设气体是光 学稀疏的,有速率方程:

Fig. 6 Schematic diagram of energy levels illustrating laserinduced fluorescence

$$\left. \begin{array}{c} (dn_{1}/dt) = (n_{2} - n_{1})B_{12}P - (n_{1}/\tau_{1}) \\ + (n_{2}/\tau_{21}) - \alpha_{1}, \\ (dn_{2}/dt) = - (n_{2} - n_{1})B_{12}P - (n_{2}/\tau_{2}) - \alpha_{2}, \end{array} \right\}$$
(1)

式中 n_2 、 n_1 分别是激光共振上、下能级的粒子集居数, τ_2 、 τ_1 是相应能级的寿命, P 为激励激光功率, τ_{21} 是 能级2 到能级1的衰减时间常数, τ_2/τ_{21} 为分支比, B_{10} 为爱因斯坦系数, α_1 和 α_2 分别为能级1、2的碰撞激

发速率。当没有激光激励(P=0)时,即稳态情况:

$$\left.\begin{array}{c}n_{20} = \alpha_{2}\tau_{2},\\n_{10} = \alpha_{1}\tau_{1} + (\tau_{1}\alpha_{2}\tau_{2}/\tau_{21})_{o}\end{array}\right\}$$
(2)

此时的自发发射荧光强度 I23 为

$$I_{23} = C_I n_{20} / \tau_{23}, \tag{3}$$

式中的 C₁ 是比例常数, 与探测系统等都有关。 在激光 P 作用下, 系统达到稳态后, 由方程 (1) 取稳态情况, 有:

$$n_{2} = \frac{n_{20} - B_{12}P\{\tau_{2}n_{10} + [1 - (\tau_{2}/\tau_{12})]\tau_{1}n_{20}\}}{1 - B_{12}P\{\tau_{2} + \tau_{1}[1 - (\tau_{2}/\tau_{12})]\}},$$

$$\Delta n_{2} = n_{2} - n_{20} = \frac{(n_{10} - n_{20})B_{12}P\tau_{2}}{1 + B_{12}P\{\tau_{2} + \tau_{1}[1 - (\tau_{2}/\tau_{12})]\}}$$

$$(4)$$

激光感生荧光强度 4I23 为

$$\Delta I_{23} = C_I \Delta n_2 / \tau_{23}, \tag{5}$$

将(4)式代入(5)式得

$$\Delta I_{23} = -C_I B_{12} P \tau_2 (n_{20} - n_{10}) / \tau_{23} \{ 1 + B_{12} P [\tau_1 + \tau_2 - (\tau_1 \tau_2 / \tau_{12})] \}_{o}$$
(6)

8. 粒子数反转的机理

由于同一上能级的不同感生荧光谱 *AI*28 与自发辐射强度 *I*28 成正比, 而 *I*28 取决于 *A*28 的大小。 对 *A*28^{15,63} 值的分析及实测的 *I*28 值都表明在我们所测量的频域及仪器灵敏 度 范围内,最可能探测到以上所示的四条感生荧光谱。

我们认为, HCD 中 Ar⁺ 能级间粒子数反转的形成机理与正柱放电中的情况是类似的。 由于 HCD 中特殊的电子能量分布 (HCD 中电子能量分布较正柱放电中的麦克斯威分布具 有更多的高能电子)和较高的电子密度^{17,80}, 使具有较大的电子碰撞激发截面¹⁶⁰的 Ar⁺ 4p 和 4s 组态主要通过电子碰撞激发形成。由于电子碰撞激发偏向于激发 4p 态 Ar⁺ 离子, 而 4s 态激发速率较小¹⁶⁰, 因而可以使 Ar⁺ 4*p*-4s 态间形成为转。

三、结 束 语

我们已经从实验中探测到了纯氩稳态直流 HCD 中 Ar⁺ 4p-4s 态间负的激光感生 荧光 信号,这被解释为这组能态间粒子数形成了反转。这一结果表明有可能制作纯 Ar 空心阴 极放电激光器。

参考文献

- [1] Toshio Goto et al.; IEEE J. Quant. Electron., 1971, QE-7, No. 11 (Dec), 555.
- [2] K. Bozsa et al.; Opt. Commun., 1977, 23, No. 1 (Oct), 15.
- [3] R. Solanki et al.; Appl. Phys. Lett., 1979, 35, No. 4 (Aug), 317.
- [4] 胡企铨、殷立峰等; 《光学学报》, 1985, 5, No. 8 (Aug), 673。
- [5] R. L. Rudko, C. L. Tang; J. Appl. Phys., 1967, 38, No. 12 (Nov), 4731.
- [6] Stats et al.; J. Appl. Phys., 1965, 36, No. 7 (Jul), 2278.
- [7] P. Gill, C. E. Webb; J. Phys. (D): Appl. Phys., 1978, 11, No. 3 (Feb), 245.
- [8] 成都电讯工程学院、北京工业大学编;《激光器件》、(湖南科学技术出版社,1981),第一章。
- [9] W. B. Bennett et al.; Phys. Rev. Lett., 1960, 17, No. 19 (7 Nov), 987.

6卷

>

Population inversion between $Ar^+ 4p$ and 4s levels in HCD of pure argon

LI SHIFANG, HU QIQUAN, YIN LIFENG AND LIN FUCHENG (Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

(Received 17 February 1985; revised 28 March 1985)

Abstract

Population inversion between $Ar^+ 4p$ and 4s levels was detected in the direct current hollow cathode discharge (HCD) of pure argon by laser-induced fluorescence measurement. Experimental data were obtained and analysed.